Notice of References Cited					1 00/054 475 LRe X		olicant(s)/Patent Under xamination N-EI ET AL.	
				Examiner	Examiner		·	
L				Dung (Mi	chael) T Nguyen	2828	Page 1 of 1	
_				U.S. PATENT DOC				
Ľ	-	Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY		Name			
L	- A	US-US006452880B1					Classification	
L	В	US-						
	С	US-						
	D	US-						
	E	US-						
L	F	US-					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
L	G	US-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
L	Н	US-						
L	ı	US-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
	J	US-						
	к	US-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
	L	US-						
	М	US-						
				FOREIGN PATENT DO	CUMENTS		<u> </u>	
*	ļ	Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	· _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _		Classification	
	N	JP 63175490 A	07-1988	Japan	NAKADA et al.		H01S 03/18	
_	0							
	P							
_	Q						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	R							
	S							
	T				i i		 	
*				NON-PATENT DOCUM	•			
-		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)						
	U	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	v							
-								
	W					· 		
- 1	- 1				-			

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)

Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.